## ЭКСИТОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СЕГНЕТОЭЛАСТИКОВ Cs<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub> и Rb<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub>.

## Харьковский национальный университет радиоэлектроники Ст. Б. Д. Кравченко Рук. доц. Е.Н. Коваленко

Соединения  $Cs_2CdI_4$  и  $Rb_2CdI_4$  относятся к сегнетоэластикам с несоразмерной фазой. Сегнетоэластиками являются кристаллы, в которых при понижении температуры возникает спонтанная деформация кристаллической решетки в отсутствие внешних механических напряжений. Оба соединения в упорядоченной соразмерной фазе имеют орторомбическую решетку с близкими параметрами, что способствуют образованию твердых растворов во всем интервале концентраций.

В настоящей работе исследованы спектры поглощения твердых растворов  $(Cs_{1-x}Rb_{x})_{2}CdI_{4}$  в интервале концентраций  $0 \le x \le 1$ .

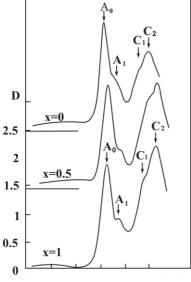


Рис. 1. Спектры поглощения тонких пленок ( $Cs_{1-x}Rb_y$ )<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub>.

По структуре спектра и положению основных полос спектры поглощения тонких пленок ( $Cs_1$   $_xRb_x$ ) $_2CdI_4$   $0 \le x \le 1$  подобны (рис.1). В спектрах при T=90 К наблюдаются интенсивная  $A_1$ -полоса, более слабая  $A_2$ -полоса, высокочастотные  $B_1$  и  $B_2$ -полосы. С ростом температуры A и B полосы сдвигаются в длинноволновую область спектра, уширяются и ослабляются за счет экситон-фононного взаимодействия, что указывает на их связь с экситонными возбуждениями.

Параметры длинноволновых экситонных полос (положение  $E_m$ , полуширина  $\Gamma$  и  $\epsilon_{2m}$  — значение мнимой части диэлек-

трической проницаемости в максимуме полосы) определялись путем аппроксимации экспериментальной зависимости оптической плотности смешанным симметричным контуром, представляющим собой линейную комбинацию лоренцева и гауссова контуров. При аппроксимации добивались наилучшего согласия расчетного контура с измеренными спектрами оптической плотности на длинноволновом склоне полос.

Было обнаружено, что концентрационный ход  $E_m(x)$  и  $\Gamma(x)$ линеен и описывается зависимостями

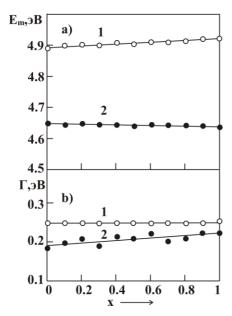


Рис. 2 Концентрационная  $\Gamma(x)$  (б) длинноволновых экситонных полос  $A_1(2)$  и  $A_2(1)$ .

зависимость спектрального положения  $E_m(x)$  (a) и полуширины

 $E_m(x) = E_m(0) + ax,$  $\Gamma(x) = \Gamma(0) + Ax,$ где  $E_m(0) = 4.65$ , 4.89 эВ, a = $dEm/dx = -1.2 \cdot 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-3} \text{ 3B},$  $\Gamma(0) = 0.18, 0.25 \text{ 3B}, A = d\Gamma/dx$  $=4.5\cdot 10^{-3}$ , 0 эВ для полос  $A_1$  и  $A_2$ .

Для выяснения характера экситонных состояний в  $(Cs_1 - {}_xRb_x)_2CdI_4$ был оценен радиус экситона  $a_{ex}$ :  $a_{ex} = 6.5 \text{ Å}$ для  $Cs_2CdI_4$  и  $a_{ex} = 8.2$  Å для Rb<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub>.

Полученные данные были использованы для сравнения характеристик экситонов в Cs<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub> и Rb<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub> с соответствующими характеристиками для CdI2, RbI и CsI, синтез которых дает кристаллическую структуру сегнетоэластиков.

Результаты всестороннего анализа свидетельствуют о локализации экситонных состояний в подрешетке  $CdI_2$  в большей степени в Rb<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub> и в меньшей в Cs<sub>2</sub>CdI<sub>4</sub> и на принадлежность экситонов в сегнетоэластиках экситонам проме-

жуточной кулоновской связи.